

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-21631-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 27.12.2023

Ausstellungsdatum: 27.12.2023

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Deutsche Telekom Security GmbH
Prüfstelle für IT Sicherheit
Bonner Talweg 100
53113 Bonn

mit dem Standort

Deutsche Telekom Security GmbH
Prüfstelle für IT Sicherheit
Bonner Talweg 100
53113 Bonn

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prüfungen in den Bereichen:

- 1) Prüfungen von Produkten aus dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik (ICT)**

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-21631-01-00

Das Labor erbringt die Prüfung anhand folgender Prüfverfahren

1. SOP Fault Injection
2. SOP Seitenkanalprüfungen
3. SOP Zufallszahlengenerator BSI-Testprogramm

Basierend auf

- ISO/IEC 15408-1:2009, ISO/IEC 15408-2:2008, ISO/IEC 15408-3:2008, ISO/IEC 15408:2022
- ISO/IEC 18045:2008, ISO/IEC 18045:2022
- ISO/IEC TS 23532-1:2021

Die Prüfungen erfolgen bei nachfolgenden Technologien und anhand nachfolgender Assurance Families. Alle Protection Profiles, deren Anforderungen gleich hoch sind wie oder unter den hier gelisteten EAL Niveaus liegen, können bewertet werden. Etwaige Anforderungen an die Assurance Class „Life-cycle support“ (ALC) innerhalb eines Protection Profiles sind dabei nicht zu berücksichtigen.

Die Assurance Class ALC wird nicht durch das Prüflabor betrachtet, die Ergebnisse sind jedoch in die Prüfung zu integrieren.

Zulässige Assurance Family Prüfungen	Prüfobjektgruppen (Target of Evaluation)	Maximales Assurance Family Level	Ausreichend für EAL (informativ)
ACE_CCL	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
ACE_ECD	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
ACE_INT	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
ACE_OBJ	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	-
ACE_REQ	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	-
ACE_SPD	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
ACE_MCO	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-21631-01-00

Zulässige Assurance Family Prüfungen	Prüfobjektgruppen (Target of Evaluation)	Maximales Assurance Family Level	Ausreichend für EAL (informativ)
ACE_CCO	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
APE_INT	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
APE_CCL	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
APE_SPD	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
APE_OBJ	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	-
APE_ECD	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
APE_REQ	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	-
ADV_ARC	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	7
ADV_FSP	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	6	7
ADV_IMP	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	7
ADV_INT	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	3	7
ADV_SPM	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	7
ADV_TDS	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	6	7
ADV_COMP	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	7

Gültig ab: 27.12.2023

Ausstellungsdatum: 27.12.2023

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-21631-01-00

Zulässige Assurance Family Prüfungen	Prüfobjektgruppen (Target of Evaluation)	Maximales Assurance Family Level	Ausreichend für EAL (informativ)
AGD_OPE	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	7
AGD_PRE	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	7
ASE_CCL	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	7
ASE_ECD	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	7
ASE_INT	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	7
ASE_OBJ	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	7
ASE_REQ	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	7
ASE_SPD	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	7
ASE_TSS	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	7
ASE_COMP	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	7

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-21631-01-00

Zulässige Assurance Family Prüfungen	Prüfobjektgruppen (Target of Evaluation)	Maximales Assurance Family Level	Ausreichend für EAL (informativ)
ATE_COV	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	3	7
ATE_DPT	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	4	7
ATE_FUN	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	7
ATE_IND	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	3	7
ATE_COMP	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	7
AVA_VAN	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	5	7
AVA_COMP	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	7

Verwendete Abkürzungen:

- DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
- EN Europäische Norm
- IEC International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission
- ISO International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung

Code	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9
	Network Protocols	Communication protocols	Low-Level interfaces	Wireless	Hardware components protocols	Phone and VoIP	Mobile networks	Filtering	Intrusion detection

Code	H1	H2	H3
	Secure hardware components architectures	Hardware sensors, reactive technology	Platforms and applications security

Code	SC	SB
	Smart Cards and similar devices	Hardware devices with security boxes

Code	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
	Hardware architectures	Personal computer and server security	Embedded systems, microkernels	Virtualization	Applicative security	Databases	Web technologies